

1 適用範圍：

- 1.1 本規範適用於RST系列低阻無鉛、無鹵素符合RoHS條款的厚膜晶片電阻器。
- 1.2 具優良的耐硫性能(參考ASTM-B-809-95&EIA977硫蒸氣試驗)。
- 1.3 該產品應用於一般電子用途。

2 型別名稱：

(例)



型別	尺寸	電阻值		容差	硫化測試	包裝型式(請參閱 IE-SP-054)
耐硫化系列低阻值 厚膜晶片電阻器	02(0402) 03(0603) 05(0805) 06(1206) 12(1210) 20(2010) 25(2512)	4-碼	EX.0.1Ω=R100	F=± 1% J=± 5%	A: 60°C	TH : 2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs H1 : 2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H2 : 2 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs H3 : 2 mm Pitch Carrier Tape 30000 pcs H4 : 2 mm Pitch Carrier Tape 40000 pcs H5 : 2 mm Pitch Carrier Tape 50000 pcs H6 : 2 mm Pitch Carrier Tape 60000 pcs TP : 4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs P2 : 4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs P3 : 4 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs P4 : 4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs TE : 4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs

IE

QA

備註

發行管制章DATA Center.

制訂  
王荷花

審查  
劉

核准  
林啟

會簽  
林昕

非發行管制文件  
自行注意版本更新

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

3 規格表：

型別	額定功率	最高 額定電流	最高 過負荷電流	T.C.R (ppm / °C) 溫度係數	阻值範圍
					F(±1%)、J(±5%) E-24、E-96
RST02 (0402)	$\frac{1}{16}$ W	1.44A	3.60A	±1500	30mΩ ≤ R < 37mΩ
				±1200	37mΩ ≤ R < 60mΩ
				±600	60mΩ ≤ R < 100mΩ
				±500	100mΩ ≤ R < 400mΩ
				±300	400mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST03 (0603)	$\frac{1}{10}$ W	1.82A	4.56A	±1500	30mΩ ≤ R < 37mΩ
				±1200	37mΩ ≤ R < 60mΩ
				±600	60mΩ ≤ R < 100mΩ
				±200	100mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST05 (0805)	$\frac{1}{8}$ W	2.50A	6.25A	±1200	20mΩ ≤ R < 33mΩ
				±800	33mΩ ≤ R < 50mΩ
				±600	50mΩ ≤ R < 100mΩ
				±300	100mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST06 (1206)	$\frac{1}{3}$ W	4.08A	10.20A	±1200	20mΩ ≤ R < 25mΩ
				±1000	25mΩ ≤ R < 50mΩ
				±600	50mΩ ≤ R < 100mΩ
				±300	100mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST12 (1210)	$\frac{1}{2}$ W	5.00A	12.50A	±1000	20mΩ ≤ R < 25mΩ
				±700	25mΩ ≤ R < 50mΩ
				±400	50mΩ ≤ R < 100mΩ
				±300	100mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST20 (2010)	$\frac{3}{4}$ W	6.12A	15.31A	±1200	20mΩ ≤ R < 25mΩ
				±900	25mΩ ≤ R < 50mΩ
				±500	50mΩ ≤ R < 100mΩ
				±300	100mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST25 (2512)	1W	7.07A	17.67A	±1200	20mΩ ≤ R < 25mΩ
				±900	25mΩ ≤ R < 50mΩ
				±500	50mΩ ≤ R < 100mΩ
				±300	100mΩ ≤ R < 1000mΩ
使用溫度範圍				-55°C ~ +155°C	

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

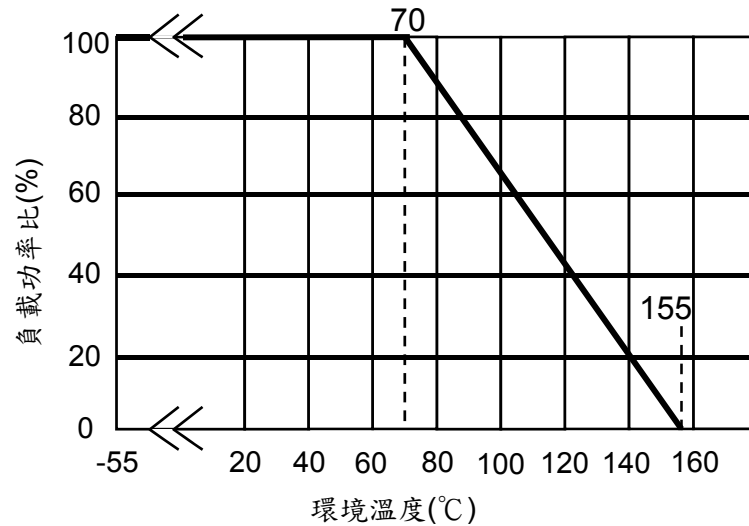
非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

### 3.1 功率衰減曲線

使用溫度範圍：-55 ~ +155 °C

周圍溫度若超過70°C至155°C之間，功率可照下圖曲線予以修定之。



### 3.2 額定電流：

額定電流：對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電流時，則以最高額定電流為其額定電流。

$$I = \sqrt{P/R}$$

I=額定電流(A)

P=額定功率(W)

R=公稱阻值(Ω)

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

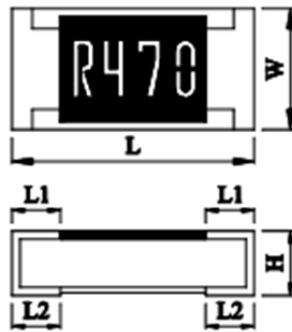
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

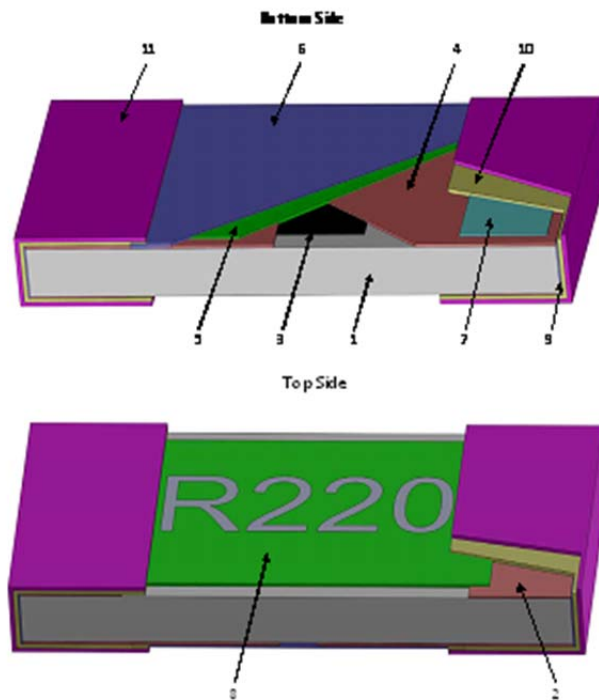
4 尺寸：

Unit:mm



Dimension		L	W	H	L1	L2
Type	Size Code					
RST02	0402	1.00±0.10	0.50±0.05	0.30±0.10	0.25±0.10	0.20±0.15
RST03	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.45±0.10	0.25±0.15	0.35±0.15
RST05	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.50±0.10	0.35±0.20	0.35±0.20
RST06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.55±0.25
RST12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RST20	2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20
RST25	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20

5 結構圖：



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	7	2nd背面內部電極	2nd Bottom inner electrode
2	正面內部電極	Top inner electrode	8	G2+MK層	G2 layer+Marking
3	電阻層	Resistive layer	9	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	1st背面內部電極	1 <sup>st</sup> Bottom inner electrode	10	Ni層電鍍	Ni plating
5	1st保護層	1st Protective coating	11	Sn層電鍍	Sn plating
6	2nd保護層	2nd Protective coating			

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

**6 信賴性試驗項目：**

Item	Conditions	Specifications
		Resistors
High Temperature Exposure (Storage)	Put the specimens in the chamber with temperature of 155±3℃ for 1000 hours. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Experiment evidence: AEC-Q200	ΔR%=±2.0%
Temperature Cycling	Put the specimens in the High & low temperature test chamber with temperature varies from -55℃ to 125℃ for 5 minutes and total 1000 cycles. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Experiment evidence: AEC-Q200	ΔR%=±2.0%
Short Time Overload	Applied 2.5 times rated current for 5 seconds and release the load for about 30 minutes, then measure its resistance variance rate. (Rated current refers to item 3. general specifications) Refer to JIS-C5201-1 4.13	ΔR%=±2.0%
Biased Humidity	Solder the specimens on the test PCB and put them into the constant temperature humidity chamber with 85±2℃ and 85±5%RH. Then apply the test voltage that calculates based on the 10% of rated power for 1000hrs. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Experiment evidence: AEC-Q200	ΔR%=±3.0%
Operational Life	Solder the specimens on the test PCB and Put them in the chamber with temperature of 125±3℃ and load the current for 1000 hours. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Note: The input current shall refer to the power de-rating curve (referring to page 2, No.3.1) Experiment evidence: AEC-Q200	ΔR%=±3.0%
Board Flex (Bending Test)	Solder the specimens on the test PCB and put the PCBA onto the Bending Tester. Add force at the central part of PCB, and the duration of the applied forces shall be 60 (+ 5) Sec. Measure of its resistance variance rate in load. Bending depth D: 0402、0603、0805=5mm 1206、1210=3mm 2010、2512=2mm Experiment evidence: AEC-Q200	ΔR%=±2.0% No mechanical damage, peel-off of side end or chip crack.

Item	Conditions		Specifications	
			Resistors	
Resistance to Soldering Heat	The specimens are fully immersed into the Pb-free solder pot, then take them out to stabilize for 1 hour or more and measure of its resistance variance rate. Temp of solder pot : 260±5°C Soldering duration : 10±1sec.  Experiment evidence AEC-Q200		ΔR%=±2.0%	
ESD	Put the specimens on the test fixture and two (2)discharges (2KVDC) shall be applied to each PUT, one (1) with a positive polarity and one (1) with a negative polarity. Afterwards, the specimens stabilize for 30min or more and measure of its resistance variance rate. The test is performed with direct contact and regular discharge mode. The resistor and capacitor used on the spearhead is 2000Ω and 150pF respectively.  Experiment evidence AEC-Q200		ΔR%=±3.0%	
Solderability	<b>Test method:</b> <b>Test item 1 (solder pot test): Method B</b> Precondition: The specimens are subjected to 155°C dry bake for 4hrs±15min. The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of 235± 5°C for 5+0/-0.5 sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope. <b>Test item 2 (Leaching test): Method D</b> The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of 260±5°C for 30+0/-0.5 sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope.  Experiment evidence AEC-Q200		1.Soldering coverage over 95% 2.At the edge of terminal, the object underneath (e.g. white ceramic) shall not expose.	
Electrical Characterization	$TCR (ppm/^\circ C) = \frac{(R2-R1)}{R1(T2-T1)} \times 10^6$ R1: Resistance at room temperature (Ω) R2: Resistance at -55°C or +125°C (Ω) T1: Room temperature (°C) T2: Temperature -55°C or +125°C  Experiment evidence: AEC-Q200		Refer to item 3. General specifications	
Sulfuration Test	Class : A	Put the tested resistor in sulfur vapor, at a temperature of 60±2°C for 1000hrs Refer to ASTM-B-809-95&EIA977	ΔR=±4.0%	Refer to item 3. general specifications

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

7 阻值測試包裝標準量測位置：

背面電極量測		Unit : mm	
TYPE	DIM	A	B
		RST02	0.80±0.05
RST03	1.35±0.05	0.35±0.05	
RST05	1.80±0.05	0.35±0.05	
RST06	2.90±0.05	0.35±0.05	
RST12	2.90±0.05	0.35±0.05	
RST20	4.50±0.05	1.15±0.05	
RST25	5.90±0.05	1.60±0.05	

⊕ Current Terminal  
⊖ Voltage Terminal

8 鍍層厚度：

8.1 鍍層厚度： $\geq 2 \mu\text{m}$

8.2 純錫： $\geq 3 \mu\text{m}$

8.3 電鍍純錫為霧錫

9 包裝空料數規定：

9.1 每一Reel空料數未超過該捲總數0.1%及連續2顆(含)以上時，是被允許的。

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

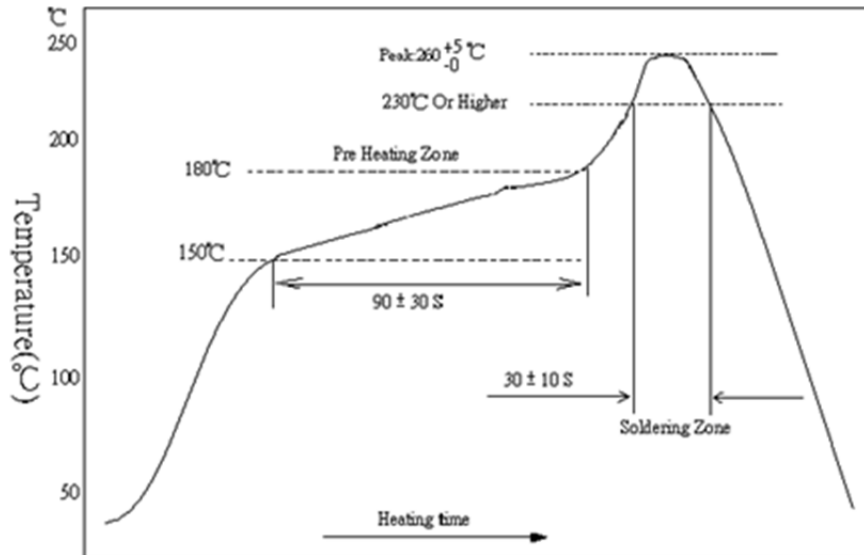
非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

10 技術應用說明: (此為建議，請客戶使用時依實際應用作調整)

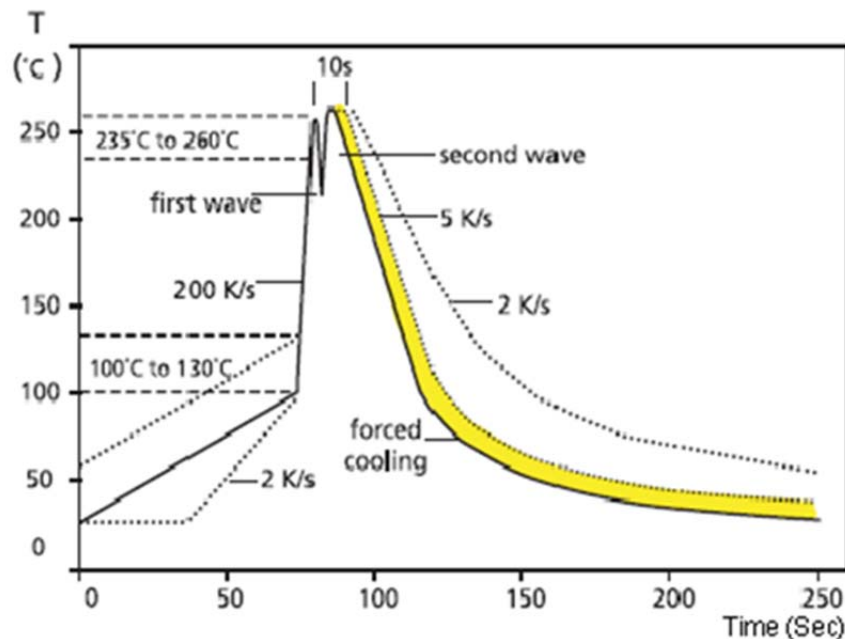
10.1 建議焊錫條件:

10.1.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile



備註：零件最高耐溫 260 +5/-0 °C，10 秒。

10.1.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品)



10.1.3 烙鐵焊錫方法：350±10°C 3秒之內。

備註

非發行管制文件  
自行注意版本更新

非經允許，禁止自行影印文件

發行管制章DATA Center.

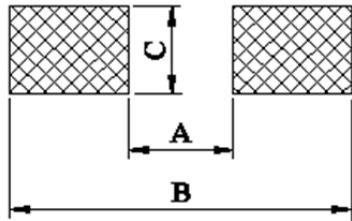
Series No. 60



### 10.2 建議 Land Pattern Design (For Reflow Soldering) :

當元件被焊接時，焊接後的電阻值根據焊接區域的大小和焊接量的不同而稍有變化。設計電路時，有必要考慮其電阻值降低或增加的影響。

Unit:mm



DIM TYPE	A	B	C
RST02	0.5	1.5	0.6
RST03	0.8	2.1	0.9
RST05	1.2	3.0	1.3
RST06	2.2	4.2	1.6
RST12	2.2	4.2	2.8
RST20	3.5	6.1	2.8
RST25	3.8	8.0	3.5

### 10.3 使用環境注意事項:

此規格產品為一般電子用途，RALEC將不為任何使用在特殊環境下，使用此規格產品導致之損害、費用或損失負責，如有其他應用需與RALEC進行確認是否適用。若客戶端有意於特殊環境或狀態下使用本公司產品(包括但不限於如下所示)，則需針對下列或其他運用環境各別承認產品特性及信賴性。

- (a) 運用於高溫高濕之環境；
- (b) 於接觸海風或運用於其他腐蝕性氣體之環境:Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>及NO<sub>2</sub>；
- (c) 於非驗證過液體中使用，包括水、油、化學品及有機溶劑；
- (d) 使用非驗證過之樹脂或其他塗層材料來封合或塗層本公司產品；
- (e) 於焊錫後之清洗，需使用水溶性清潔劑清洗殘留於產品助焊劑，縱然使用免洗助焊劑仍建議清洗。

### 10.4 暫態過載注意事項:

本產品可能對於暫態過載而導致產品之功能喪失，請注意您的製造過程和保存，避免發生高於產品規格之暫態電流施加在產品上

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

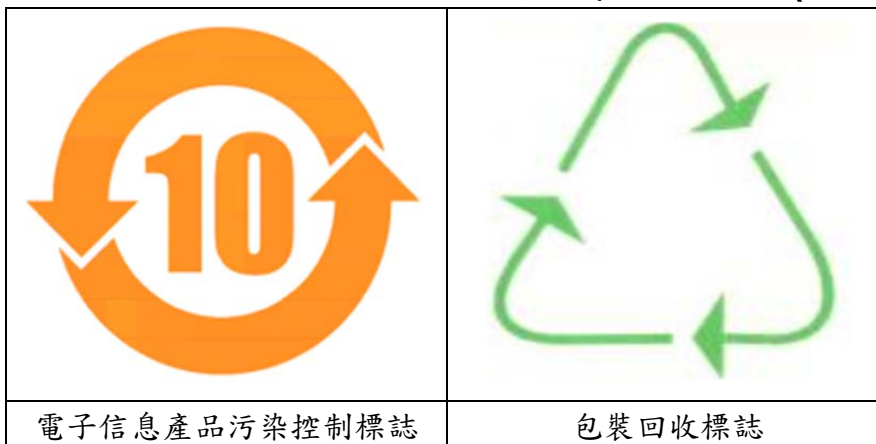
10.5 作業及處理注意事項：

- (a) 作業時需確保電阻邊緣及保護層免於機械應力破壞。
- (b) 印刷電路板 (PCB) 分開或固定在支撐體上時應小心操作，因為印刷電路板 (PCB) 安裝的彎曲會對電阻器造成機械應力。
- (c) 電阻需於規格中額定功率範圍內使用，尤其當功率超出額定值時，將會負載在電阻上，有可能因溫度上升造成機器損害。
- (d) 若電阻短時間將可能承受大量負載(脈衝波)衝擊時，必須於使用前設置作業環境。
- (e) 使用該產品時請在貴司實裝狀態下評估及確認，充分考慮故障安全設計，確保系統上的安全性。

11 儲存及搬運條件：

- 11.1 在儲存環境 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 $60\pm 15\%$ 之條件下可儲存二年。
- 11.2 存儲時請避開如下惡劣環境，以免影響產品性能及焊錫連接性：海風、 $\text{Cl}_2$ 、 $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{NH}_3$ 、 $\text{SO}_2$ 及 $\text{NO}_2$ 等腐蝕性氣體的場所，陽光直射、結露場所。
- 11.3 產品搬運、存儲時請保證箱體的正確朝向，嚴禁摔落、擠壓箱體，否則可能造成產品電極或本體受損。

12 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示：(外銷中國大陸)



13 附件：

- 13.1 文件修訂記錄表(QA-QR-027)

備

非 發 行 管 制 文 件  
自 行 注 意 版 本 更 新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

RALEC 旺詮	RST(A)系列低阻厚膜晶片電阻器 規格標準書	文件編號	IE-SP-178
		版本日期	2020/05/15
		頁次	11

### 法律免責聲明

RALEC 及其經銷商與代理商(以下統稱"RALEC")不因任何產品相關資訊(包括但不限於產品規格、資料、圖片和圖表)中包含的任何錯誤、不正確或不完整，而承擔任何責任。RALEC 可能隨時對產品相關資訊進行更改、修訂或改善，恕不另行通知。

RALEC 對於其產品使用於特殊目的之適用性或其任何產品的持續生產不為任何承諾、保證及/或擔保。在法律准許的最大程度內，RALEC 不承擔任何下述之責任：(i)因應用或使用任何 RALEC 產品而產生之任何及所有責任，(ii)任何及所有責任，包括但不限於因 RALEC 產品所造成或與 RALEC 產品相關的利潤損失或是直接損害、間接損害、特別損害、懲罰性損害、衍生性損害或附帶性損害，及(iii)任何及所有默示保證，包括產品適用於特殊用途、非侵權、及適銷性。

RALEC 將此產品定義為一般電子用途，不適用於任何車用電子、醫療救生或維生設備，亦不適用於當 RALEC 產品故障時，可能造成人員傷亡之任何應用上。RALEC 所提供的任何及所有的關於產品應用上的技術建議，均為無償提供，RALEC 對於採用該等技術建議及可獲取的結果，不承擔任何義務及責任，採用該等建議之所有風險，概由買方承擔。買方將 RALEC 產品使用於與其他材料或原料結合、或實施於其任何製程中之組合，所產生的所有風險及責任，概由買方承擔，不論 RALEC 對於產品的使用給予任何口頭或書面的技術說明、建議或其他。

此處所提供之資訊僅為說明產品規格，產品未變更時，RALEC 保有修改此內容不另行通知之所有權利，任何產品變更將會以 ECN 公布。

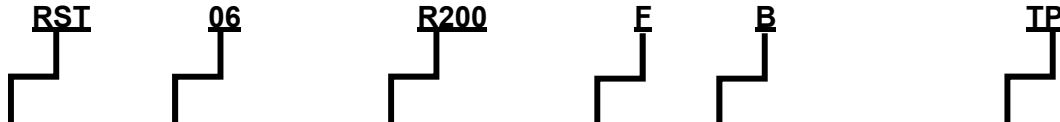
備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制章DATA Center.
	非經允許，禁止自行影印文件	Series No. 60

1 適用範圍:

- 1.1 本規範適用於RST系列低阻無鉛、無鹵素符合RoHS條款的厚膜晶片電阻器。
- 1.2 具優良的耐硫性能(參考ASTM-B-809-95&EIA977硫蒸氣試驗)。
- 1.3 該產品應用於一般電子用途。

2 型別名稱:

(例)



型別	尺寸	電阻值		容差	硫化測試	包裝型式(請參閱 IE-SP-054)
耐硫化系列低阻值 厚膜晶片電阻器	06(1206) 12(1210) 20(2010) 25(2512)	4-碼	EX.0.2Ω=R200	F=± 1% J=± 5%	B : 105°C	TP : 4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs P2 : 4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs P3 : 4 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs P4 : 4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs TE : 4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs

3 規格表:

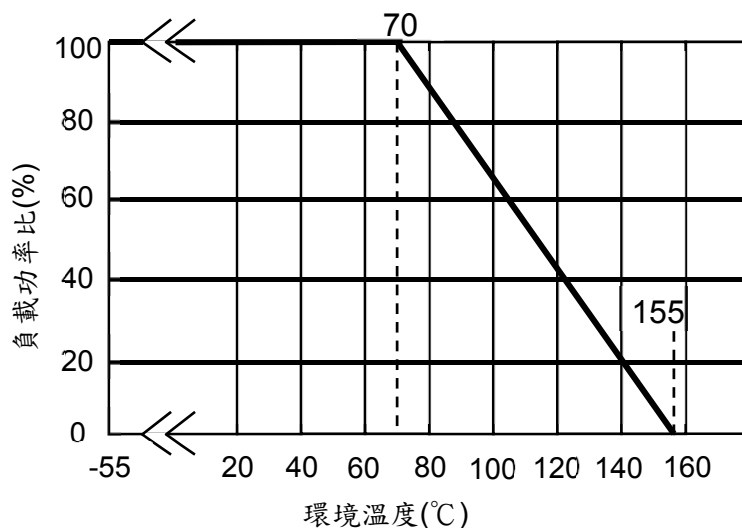
型別	額定功率	最高 額定電流	最高 過負荷電流	T.C.R ( ppm / °C ) 溫度係數	阻值範圍
					F(±1%)、J(±5%) E-24、E-96
RST06 (1206)	$\frac{1}{3}$ W	1.29A	3.23A	±300	200mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST12 (1210)	$\frac{1}{2}$ W	1.58A	3.95A	±300	200mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST20 (2010)	$\frac{3}{4}$ W	1.94A	4.84A	±300	200mΩ ≤ R < 1000mΩ
RST25 (2512)	1W	2.24A	5.59A	±300	200mΩ ≤ R < 1000mΩ
使用溫度範圍				-55°C ~ +155°C	

RD		QA		備註 非發行管制文件 自行注意版本更新 非經允許，禁止自行影印文件	發行管制章DATA Center.  Series No.60
制訂 王茹	審查 [Signature]	核准 王嘉年	會簽 [Signature]		

### 3.1 功率衰減曲線

使用溫度範圍：-55 ~ +155 °C

周圍溫度若超過70°C至155°C之間，功率可照下圖曲線予以修定之。



### 3.2 額定電流

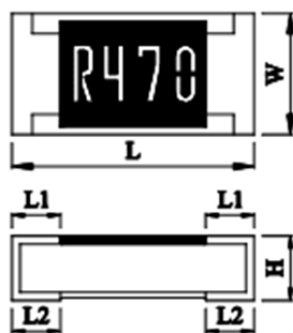
額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。

可用下列公式求得，但求得之值若超過規格表內之最高電流時，則以最高額定電流為其額定電流。

$$I = \sqrt{P/R}$$

I=額定電流(A)  
P=額定功率(W)  
R=公稱阻值(Ω)

## 4 尺寸:



Dimension		Unit:mm				
Type	Size Code	L	W	H	L1	L2
RST06	1206	3.05±0.10	1.55±0.10	0.50±0.10	0.45±0.20	0.35±0.15
RST12	1210	3.05±0.10	2.55±0.10	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
RST20	2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20
RST25	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	0.65±0.20	0.65±0.20

備註

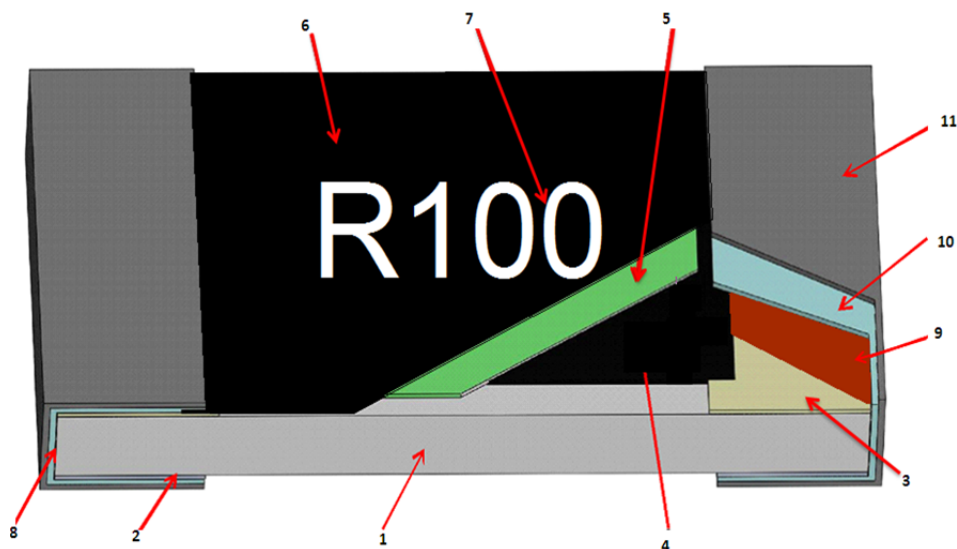
非發行管制文件  
自行注意版本更新

非經允許，禁止自行影印文件

發行管制章DATA Center.

Series No. 60

5 結構圖:



1	陶瓷基板	7	字碼
2	背面內部電極	8	側面內部電極
3	正面內部電極	9	Cu層電鍍
4	電阻層	10	Ni層電鍍
5	1st 保護層	11	Sn層電鍍
6	2nd 保護層		

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

6 信賴性試驗項目:

6.1 電氣性能試驗

項目	條件	規格
		Resistors
溫度係數	$TCR (ppm/^{\circ}C) = \frac{(R2 - R1)}{R1 (T2 - T1)} \times 10^6$ R1:室溫下量測之阻值(Ω) R2:-55°C 或 +125°C 下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度(°C) T2:-55°C 或 +125°C 之溫度(°C)  依據 JIS-C5201-1 4.8	參考3.規格表
短時間過負荷	施加2.5倍的額定電壓5秒，靜置30分鐘以上再量測阻值變化率 (額定電壓值請參考 3.規格表)  依據 JIS-C5201-1 4.13	ΔR%=±2.0%
絕緣電阻試驗	將晶片電阻置於治具上，在正負極施加100VDC一分鐘後，測量電極與保護層及電極與基板(底材)間之絕緣電阻值 依據 JIS-C5201-1 4.6  	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
絕緣耐電壓	將晶片電阻置於治具上，在正、負極施加VAC (參考下列) RST06、12、20、25用500VAC一分鐘  依據 JIS-C5201-1 4.7	無短路或燒毀現象。
斷續過負荷	置於恆溫箱中，施加2.5倍額定電流，1秒ON，25秒OFF，計10000+400/-0次後取出靜置60分鐘後量測阻值變化量  依據 JIS-C5201-1 4.13	ΔR%=±5.0%

備註

非發行管制文件  
自行注意版本更新

非經允許，禁止自行影印文件

發行管制章DATA Center.

Series No. 60

6.2 機械性能試驗

項目	條件	規格
		Resistors
端電極拉力測試	測試項目一:將電阻焊在電路板上,在電阻背面施以5N的力量持續10sec後,檢查側導體外觀。 測試項目二:將電阻焊在電路板上,逐漸施加力量於電阻背面,測試端電極最大剝離強度。  依據 JIS-C5201-1 4.16	項目一:外觀無損傷,無側導脫落及本體斷裂發生。 項目二: $\geq 5N$
耐溶劑性試驗	浸於20~25°C異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後,取出靜置48hr以上,再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.29	$\Delta R\% = \pm 2.0\%$
焊錫性	前處理:將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105°C、濕度100%及氣壓 $1.22 \times 10^5$ pa的飽和條件下進行4小時的老化測試,取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法:將電阻浸於235±5°C之爐中2秒後取出置於顯微鏡下觀察焊錫面積。  依據 JIS-C5201-1 4.17	導體吃錫面積應大於95%。
抗焊錫熱	◎測試項目一(焊錫爐測試): 浸於260+5/-0°C之錫爐中10 秒+1/-0,取出靜置60分鐘以上,再量測阻值變化率。  ◎測試項目二(焊錫爐測試) 浸於260+5/-0°C之錫爐中30+1/-0秒,取出後洗淨。置於顯微鏡下觀察焊錫面積。  ◎測試項目三(電烙鐵試驗): 加熱溫度:350±10°C 電烙鐵加熱時間:3+1/-0 sec. 取電烙鐵加熱於電極兩端後,取出靜置60分鐘以上,再量測阻值變化率。  依據 JIS-C5201-1 4.18	試驗項目一: (1).阻值變化率 $\Delta R\% = \pm 2.0\%$  試驗項目二: (1).導體吃錫面積應大於95%。 (2).在電極邊緣處不應見到下層的物質(例如白基板)。  試驗項目三: (1).阻值變化率 $\Delta R\% = \pm 2.0\%$

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許,禁止自行影印文件

Series No. 60



項目	條件	規格
		Resistors
焊錫粘合強度	<p>◎彎折性測試: 將晶片電阻焊於彎折性測試板中，置於彎折測試機上，在測試板中央施力下壓，於負荷下量測阻值變化率。 下壓深度(D): RST06、12=3mm RST20、25=2mm</p> <p>依據JIS-C5201-1 4.33</p>	$\Delta R\% = \pm 2.0\%$

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

6.3 環境試驗

項目	條件	規格								
		Resistors								
耐熱性試驗	置於 $155\pm 5^{\circ}\text{C}$ 之烤箱中1000+48/-0 hrs，取出靜置1hr以上再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.25	$\Delta R\% = \pm 2.0\%$								
冷熱沖擊	將晶片電阻置入冷熱沖擊機中，溫度為 $-55^{\circ}\text{C}$ 15分鐘， $+125^{\circ}\text{C}$ 15分鐘，共計循環300次後取出，靜置60分鐘再量測阻值變化率。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">測試條件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最低溫度</td> <td><math>-55\pm 5^{\circ}\text{C}</math></td> </tr> <tr> <td>最高溫度</td> <td><math>125\pm 5^{\circ}\text{C}</math></td> </tr> <tr> <td>溫度保留時間</td> <td>15 分鐘</td> </tr> </tbody> </table> 依據 MIL-STD 202 Method 107	測試條件		最低溫度	$-55\pm 5^{\circ}\text{C}$	最高溫度	$125\pm 5^{\circ}\text{C}$	溫度保留時間	15 分鐘	$\Delta R\% = \pm 2.0\%$
測試條件										
最低溫度	$-55\pm 5^{\circ}\text{C}$									
最高溫度	$125\pm 5^{\circ}\text{C}$									
溫度保留時間	15 分鐘									
耐濕負荷	置於溫度 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中，並施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.24	$\Delta R\% = \pm 3.0\%$								
負荷壽命	置於 $70\pm 2^{\circ}\text{C}$ 之烤箱中施加額定電壓，90分鐘ON，30分鐘OFF，共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.25	$\Delta R\% = \pm 3.0\%$								
耐硫化測試	Class B 將測試電阻置於硫蒸氣中，溫度為 $105\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，持續750小時 依據ASTM-B-809-95&EIA977	$\Delta R = \pm 4.0\%$								

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

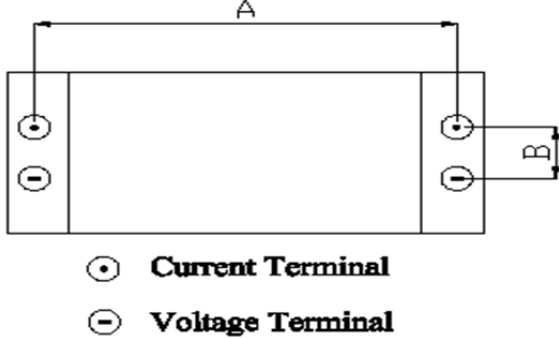
註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

7 阻值測試包裝標準量測位置:

背面電極量測		Unit : mm	
TYPE	DIM	A	B
		RST06	2.90±0.05
RST12	2.90±0.05	0.35±0.05	
RST20	4.50±0.05	1.15±0.05	
RST25	5.90±0.05	1.60±0.05	



● Current Terminal  
⊖ Voltage Terminal

8 鍍層厚度:

8.1 鍍層厚度:  $\geq 2\mu\text{m}$

8.2 純錫:  $\geq 3\mu\text{m}$

8.3 電鍍純錫為霧錫

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

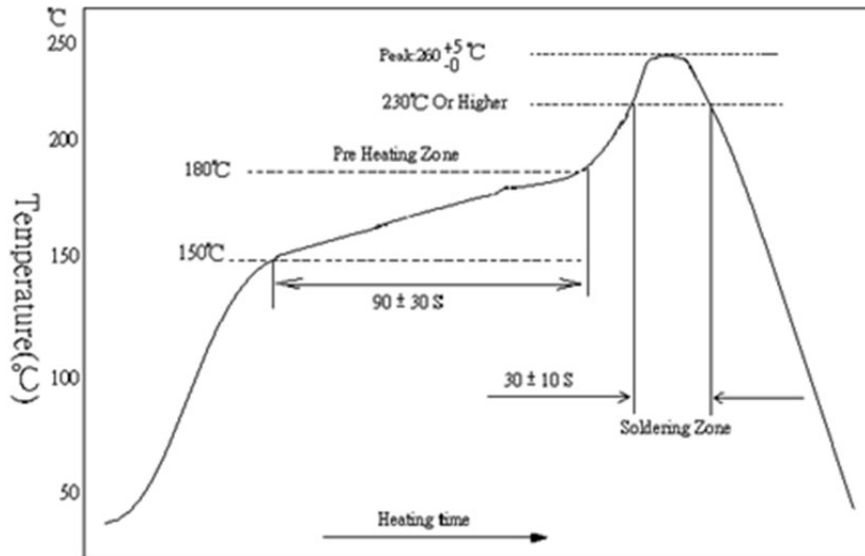
非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

9 技術應用說明(此為建議，請客戶使用時依實際應用作調整)

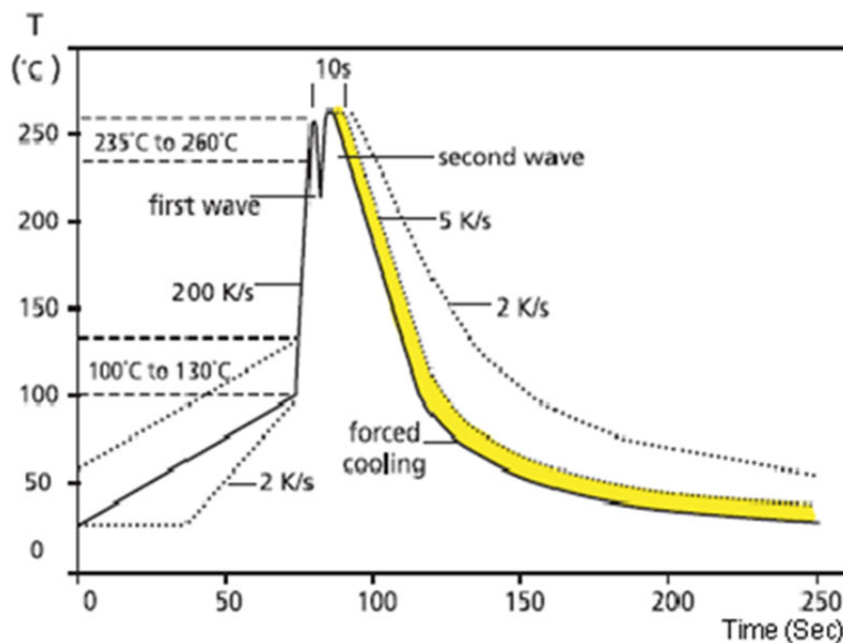
9.1 建議焊錫條件:

9.1.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile



備註:零件最高耐溫260 +5/-0 °C,10秒。

9.1.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile



9.1.3 烙鐵焊錫方法:350±10°C 3秒之內

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

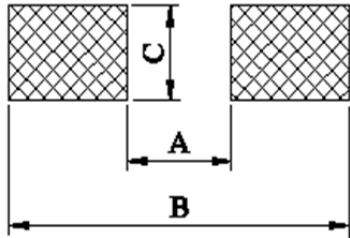
非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

### 9.2 建議Land Pattern Design(For Reflow Soldering) :

當元件被焊接時，焊接後的電阻值根據焊接區域的大小和焊接量的不同而稍有變化。設計電路時，有必要考慮其電阻值降低或增加的影響。

Unit:mm



TYPE \ DIM	A	B	C
RST06	2.2	4.2	1.6
RST12	2.2	4.2	2.8
RST20	3.5	6.1	2.8
RST25	3.8	8.0	3.5

### 9.3 使用環境注意事項：

此規格產品為一般電子用途，RALEC將不為任何使用在特殊環境下，使用此規格產品導致之損害、費用或損失負責，如有其他應用需與RALEC進行確認是否適用。

若客戶端有意於特殊環境或狀態下使用本公司產品(包括但不限於如下所示)，則需針對下列或其他運用環境各別承認產品特性及信賴性。

- (a) 運用於高溫高濕之環境。
- (b) 於接觸海風或運用於其他腐蝕性氣體之環境: Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>及NO<sub>2</sub>。
- (c) 於非驗證過液體中使用，包括水、油、化學品及有機溶劑。
- (d) 使用非驗證過之樹脂或其他塗層材料來封合或塗層本公司產品。
- (e) 於焊錫後之清洗，需使用水溶性清潔劑清洗殘留於產品助焊劑，縱然使用免洗助焊劑仍建議清洗。

### 9.4 暫態過載注意事項：

本產品可能對於暫態過載而導致產品之功能喪失，請注意您的製造過程和保存，避免發生高於產品規格之暫態電流施加在產品上。

備

非發行管制文件  
自行注意版本更新

發行管制章DATA Center.

註

非經允許，禁止自行影印文件

Series No. 60

RALEC 旺詮	RST(B)系列低阻厚膜晶片電阻器 規格標準書	文件編號	IE-SP-201
		版本日期	2021/03/11
		頁次	11



**9.5 作業及處理注意事項：**

- (a) 作業時需確保電阻邊緣及保護層免於機械應力破壞。
- (b) 印刷電路板 (PCB) 分開或固定在支撐體上時應小心操作，因為印刷電路板 (PCB) 安裝的彎曲會對電阻器造成機械應力。
- (c) 電阻需於規格中額定功率範圍內使用，尤其當功率超出額定值時，將會負載在電阻上，有可能因溫度上升造成機器損害。
- (d) 若電阻將可能接受大量負載(脈衝波)衝擊時，必須於使用前設置作業環境。
- (e) 使用該產品時請在貴司實裝狀態下評估及確認，充分考慮故障安全設計，確保系統上的安全性。

**10 儲存期限及搬運條件：**

- 10.1 在儲存環境 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 $60\pm 15\%$ 之條件下可儲存二年。
- 10.2 存儲時請請避開如下惡劣環境，以免影響產品性能及焊錫連接性：海風、 $\text{Cl}_2$ 、 $\text{H}_2\text{S}$ 、 $\text{NH}_3$ 、 $\text{SO}_2$ 及 $\text{NO}_2$ 等腐蝕性氣體的場所，陽光直射、結露場所。
- 10.3 產品搬運、存儲時請保證箱體的正確朝向，嚴禁摔落、擠壓箱體，否則可能造成產品電極或本體受損。

**11 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)**

	
電子信息產品污染控制標誌	包裝回收標誌

**12 附件：**

- 12.1 文件修訂記錄表(QA-QR-027)

備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制章DATA Center.
	非經允許，禁止自行影印文件	Series No. 60

RALEC 旺詮	RST(B)系列低阻厚膜晶片電阻器 規格標準書	文件編號	IE-SP-201
		版本日期	2021/03/11
		頁次	12

### 法律免責聲明

RALEC 及其經銷商與代理商(以下統稱"RALEC")不因任何產品相關資訊(包括但不限於產品規格、資料、圖片和圖表)中包含的任何錯誤、不正確或不完整，而承擔任何責任。RALEC 可能隨時對產品相關資訊進行更改、修訂或改善，恕不另行通知。

RALEC 對於其產品使用於特殊目的之適用性或其任何產品的持續生產不為任何承諾、保證及/或擔保。在法律准許的最大程度內，RALEC 不承擔任何下述之責任：(i)因應用或使用任何 RALEC 產品而產生之任何及所有責任，(ii)任何及所有責任，包括但不限於因 RALEC 產品所造成或與 RALEC 產品相關的利潤損失或是直接損害、間接損害、特別損害、懲罰性損害、衍生性損害或附帶性損害，及(iii)任何及所有默示保證，包括產品適用於特殊用途、非侵權、及適銷性。

RALEC 將此產品定義為一般電子用途，不適用於任何車用電子、醫療救生或維生設備，亦不適用於當 RALEC 產品故障時，可能造成人員傷亡之任何應用上。RALEC 所提供的任何及所有的關於產品應用上的技術建議，均為無償提供，RALEC 對於採用該等技術建議及可獲取的結果，不承擔任何義務及責任，採用該等建議之所有風險，概由買方承擔。買方將 RALEC 產品使用於與其他材料或原料結合、或實施於其任何製程中之組合，所產生的所有風險及責任，概由買方承擔，不論 RALEC 對於產品的使用給予任何口頭或書面的技術說明、建議或其他。

此處所提供之資訊僅為說明產品規格，產品未變更時，RALEC 保有修改此內容不另行通知之所有權利，任何產品變更將會以 ECN 公布。

備註	非發行管制文件 自行注意版本更新	發行管制章DATA Center.
	非經允許，禁止自行影印文件	Series No. 60